

หัวข้อวิจัย การวิเคราะห์หาปริมาณชาตุชีวิตลิโคนในแร่สังกะสีชั้นเล็กโดยวิธีนิวเคลียรอนดอคติเวชน์  
การวิจัย วิทยาศาสตร์มหบัญชี (การสอนพิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521  
ชื่อผู้ทำ วิจิตร วงศ์อนุกูล

#### บทคัดย่อ

การวิเคราะห์หาปริมาณชาตุชีวิตลิโคนในแร่สังกะสีชั้นเล็กโดยวิธีนิวเคลียรอนดอคติเวชน์  
กระทำโดยนำตัวอย่างแร่ไปอบรังสีนิวเคลียรอน พลังงาน 14.3 Mev. ทำให้เกิดไอโซโทฟ-  
กัมมันตรังสีขึ้น การวัดรังสีแกรมมาใช้หัวตัวแบบ NaI(Tl) มีวงจรที่อยู่ในเครื่อง  
Multichannels analyzer ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจุบันนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด  
แบบ  $^{28}\text{Si}(\text{n},\text{p})^{28}\text{Al}$ ,  $^{64}\text{Zn}(\text{n},2\text{n})^{63}\text{Zn}$  และ  $^{66}\text{Zn}(\text{n},\text{p})^{66}\text{Cu}$  ผลการวิเคราะห์  
หาปริมาณชาตุชีวิตลิโคนในแร่ตัวอย่างตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง พบวนิชชาตุชีวิตลิโคนคิดเป็นร้อยละ  
 $14.02 \pm 0.04$ ,  $18.10 \pm 0.12$  และ  $19.80 \pm 0.35$  โดยนำหนัก ส่วนแร่ตัวอย่าง  
สีน้ำตาลสูมมา 2 ตัวอย่าง พบวนิชชาตุชีวิตลิโคน  $15.92 \pm 0.11$  และ  $17.99 \pm 0.29$   
แสดงถึงความเข้มข้นของชาตุชีวิตลิโคนในแร่ตัวอย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนการหาค่าความ-  
ไวของปริมาณวิเคราะห์ของชาตุชีวิตลิโคนได้เท่ากับ  $1.099972 \times 10^{-4}$  กรัม

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

Title Determination of Silicon in Hemimorphite by Neutron Activation Analysis.

Research Master of Science (Teaching Physics) Chiang Mai University 1978.

Name Wijit Wong Anookule

#### Abstract

The determination of silicon in hemimorphite by neutron activation analysis is done by irradiating the sample with fast neutron, energy 14.3 Mev, producing radioisotopes. The gamma radioactivity is detected by NaI(Tl) counter equipped with multichannel analyzer. The nuclear reactions occurred are found to be  $^{28}_{14}\text{Si}(n,p)^{28}_{13}\text{Al}$ ,  $^{64}_{30}\text{Zn}(n,2n)^{63}_{30}\text{Zn}$  and  $^{66}_{30}\text{Zn}(n,p)^{66}_{29}\text{Cu}$ . The percentages of silicon abundance are  $14.02 \pm 0.04$ ,  $18.10 \pm 0.12$ , and  $19.80 \pm 0.35$  in three samples indicated the non-uniform distribution of silicon in the samples. The sensitivity in this measurement is  $1.099972 \times 10^{-4}$  gm.